

装置名	主要な機能 や仕様	その他 特記事項	利用条件			担当者(内線) 研究室名	詳細情報 (ページ)
			利用形態	運転・保守費用 の概略	その他 条件		

II. 形状観察・構造解析・物性計測のための装置

2-1. 顕微鏡観察

表面調整観察装置、STM装置						クラスター	
分子線エピタキシー(MBE)／走査型トンネル顕微鏡システム						半導体	
高温試料加熱ステージ付マルチモードSPMシステム						情報記録機能材料	
SPMコントロール(インターフェース付)						表面科学	
SPMコントローラ						表面科学	
走査トンネル顕微鏡						表面科学	
走査型プローブ顕微鏡システム						表面科学	
超高真空STM/AFM装置						表面科学	
走査電子顕微鏡						界面制御プロセス	
SEM付属用元素分析装置						界面制御プロセス	
走査電子顕微鏡						界面制御プロセス	
走査型電子顕微鏡						光機能物質	
走査型電子顕微鏡						半導体	
電界放射走査電子顕微鏡						情報記録機能材料	
電界放出走査電子顕微鏡						表面科学	
高温顕微鏡						半導体	
コンフォーカル顕微鏡						半導体	
デジタルマイクロスコープ						機械創成	
デジタルマイクロスコープ(コントローラ)						固体力学	
リアルサーフェスビュー顕微鏡						機械創成	
高分解能磁気解析電子顕微鏡						情報記録機能材料	
電子顕微鏡画像記録処理装置						情報記録機能材料	
透過型電子顕微鏡(含高速TEMオンアクシカメラシステム)						半導体	
オンフランジ型光電子顕微鏡						表面科学	
in situ局所構造評価装置						量子界面物性	

装置名	主要な機能 や仕様	その他 特記事項	利用条件			担当者(内線) 研究室名	詳細情報 (ページ)
			利用形態	運転・保守費用 の概略	その他 条件		

2-2. 構造解析

高分子材料解析システム						極限高分子材料	
高温X線小角散乱測定装置						フロンティア材料	
X線分析装置						半導体	
X線検出器						表面科学	
エネルギー分散形X線分析装置						表面科学	

2-3. 光学物性計測・分光分析

Nd:YAGレーザー						クラスター	
Nd:YAGパルスレーザーシステム						界面制御プロセス	
パルスNd:YAGレーザー						表面科学	
高出力グリーンレーザー						クラスター	
原子・分子解析レーザー／近紫外						クラスター	
20WグリーンYLFレーザー						クラスター	
フェムト秒レーザー再生増幅器						クラスター	
CW波長可変Ti:サファイアレーザ						ナノ電子工学	
LD励起CWグリーン固体レーザー						量子界面物性	
エキシマレーザー						フロンティア材料	
アルゴンイオンレーザー						フロンティア材料	
波長可変レーザー光源						フロンティア材料	
自動波長可変レーザーシステム						量子界面物性	
波長可変ナノ秒可変レーザー						量子界面物性	
パルスレーザー						量子界面物性	
高出力グリーンレーザー						光機能物質	
ファイバーレーザ						光機能物質	
レーザーPN分離装置						半導体	
レーザー光高速変調装置						光機能物質	
中赤外短パルスレーザーシステム						光機能物質	
高出力短パルスレーザー光源						光機能物質	
高温真空紫外分光装置						フロンティア材料	
中赤外光学パラメトリック発振器						クラスター	
MCTアレイ赤外線検出器						量子界面物性	
レーザーラマン分光光度計用冷却加熱装置						フロンティア材料	
高出力レーザーラマン分光装置						光機能物質	
顕微ラマン						表面科学	
光スペクトラムアナライザ						光機能物質	
光分散アナライザ						光機能物質	
ソーラシミュレータ						半導体	
デジタルCCD分光検出器						クラスター	
短波長帯光スペクトラムアナライザ						光機能物質	
プリフォームアナライザ						フロンティア材料	
超高分解能スペクトロメーター						光機能物質	
スーパーコンティニューム光源						光機能物質	
超短光パルス光源						光機能物質	
ラジカルビーム源						半導体	
温度可変オブティスタット						半導体	
高分解能フォトルミネッセンス測定						半導体	

装置名	主要な機能 や仕様	その他 特記事項	利用条件			担当者(内線) 研究室名	詳細情報 (ページ)
			利用形態	運転・保守費用 の概略	その他 条件		
顕微フотルミネッセンス装置						半導体	
時間分解フотルミネッセンス装置						半導体	
X線光電子分光装置						表面科学	
光電子顕微鏡用エネルギーアナライザー						表面科学	
高速蛍光寿命測定装置						量子界面物性	
超高速非線形応答特性評価装置						量子界面物性	
ピコ秒波長可変器						量子界面物性	
ナノ秒波長可変システム						クラスター	
光雑音測定装置						光機能物質	
シンセサイズド・スイーパー						光機能物質	
光干渉式膜厚計						マイクロメカトロニクス	
光学測定用4K冷凍機システム						光機能物質	
フレーム原子吸光装置						高分子ナノ複合材料	

2-4. 電気物性・磁気物性計測

半導体特性評価システム						半導体	
ICTS測定装置 (Isothermal Capacitance Transient Spectroscopy)						半導体	
エレクトロントラップ測定システム						半導体	
高倍率磁区観察装置						情報記録機能材料	
680nm光一磁気記録再生評価装置						情報記録機能材料	
超高密度光磁気記録材料評価装置						情報記録機能材料	
超広帯域磁気一光効果測定装置						情報記録機能材料	
GMRヘッドスピンスタンド装置						情報記録機能材料	
ベクトルシグナルアナライザー						光機能物質	
マイクロ波光源および信号検出装置						フロンティア材料	
広帯域オシロスコープ						光機能物質	
高感度光子計測装置						光機能物質	
分光感度測定装置						半導体	
高精度GPS						スマートビークル研究センター	

2-5. 化学的性質および量子物性計測

エクストレル四重極質量分析計用電						クラスター	
四重極質量分析装置(四重極マスフィルタ)						クラスター	
質量分析計						クラスター	
ライフタイム測定装置						半導体	
量子効率測定装置						光機能物質	
LEED/AES装置						表面科学	
オージェ電子分光装置						表面科学	
加熱機構付きアッシャー装置						マイクロメカトロニクス	
全自動元素分析装置						高分子ナノ複合材料	
窒素分析装置						材料プロセス	
電子スピン共鳴装置						半導体	
電子プローブマイクロアナライザ						材料プロセス	

2-6. その他の物性計測

高温型示差走査熱量計						フロンティア材料	
差動形高温形TG-DTA						量子界面物性	
極低温光交流法比熱測定装置						フロンティア材料	
表面形状測定器						マイクロメカトロニクス	
非接触3次元表面形状・粗さ測定装置						マイクロメカトロニクス	

装置名	主要な機能 や仕様	その他 特記事項	利用条件			担当者(内線) 研究室名	詳細情報 (ページ)
			利用形態	運転・保守費用 の概略	その他 条件		
触針式表面形状測定器						半導体	
4ch3次元音響インテンシティ						流体力学	
変位振動測定装置						機械創成	
原子層モニター装置						表面科学	
触力覚デバイス						固体力学	
屈折率膜厚測定装置						光機能物質	
2次元レーザー・ドップラー流速計						流体力学	
リアルタイムPIV装置						流体力学	